3　試験機器の状態	3　試験機器の状態
［(1)・(2)　略］	［(1)・(2)　同左］
(3)　無変調状態にできない場合は、以下のとおりとする。	(3)　無変調状態にできない場合は、フレーム構造を含む変調された連続波とし、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態とする。
ア　四分のπシフト四相位相変調方式の場合 フレーム構造を含む変調された連続波とし、フレーム内領域については標準符号化試験信号を入力した変調状態とする。	
イ　四値周波数偏位変調方式の場合 フレーム構造を含まない連続した変調状態とし、最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列の変調状態とする。	
［4・5　略］	［4・5　同左］
6　その他	6　その他
(1)　3(3)において、四分のπシフト四相位相変調方式の変調状態とした場合は、波形解析器を用いて測定する。	3(3)において、四分のπシフト四相位相変調方式の変調状態とした場合は、波形解析器を用いて測定する。
(2)　3(3)において、四値周波数偏位変調方式の変調状態とした場合は、四値周波数偏位変調方式の変調状態における最も周波数が高くなる周波数偏移と最も周波数が低くなる周波数偏移を与える符号列は＋３、＋３、－３、－３、＋３、＋３、－３、－３とする。特定の符号により測定した場合は、規定された周波数偏移を用いて中心周波数に換算する。	
［五　略］	［五　同左］
六　スプリアス発射又は不要発射の強度	六　スプリアス発射又は不要発射の強度
1　［略］	1　［同左］
2　測定器の条件	2　測定器の条件
［(1)　略］	［(1)　同左］
(2)　スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。	(2)　スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅　搬送波±62.5kHzから１MHzまでの周波数の範囲（以下この表において「近傍帯域１」という。）の場合は搬送波±１MHz、搬送波±１MHzから10MHzまでの周波数の範囲（以下この表において「近傍帯域２」という。）の場合は搬送波±10MHz、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲（以下この表において「その他の帯域」という。）の場合は100MHz	掃引周波数幅　搬送波±62.5kHzから１MHzまでの周波数の範囲（以下この表において「近傍帯域１」という。）の場合は搬送波±１MHz、搬送波±１MHzから10MHzまでの周波数の範囲（以下この表において「近傍帯域２」という。）の場合は搬送波±10MHz、搬送波±10MHz未満を除く周波数範囲（以下この表において「その他の帯域」という。）の場合は100MHz
分解能帯域幅　近傍帯域１の場合は３kHz、近傍帯域２の場合は100kHz、その他の帯域の場合は１MHz	分解能帯域幅　近傍帯域１の場合は３kHz、近傍帯域２の場合は100kHz、その他の帯域の場合は１MHz
ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度	ビデオ帯域幅　３kHz
入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値	入力レベル　最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間　１サンプル当たり１バースト以上が入る時間	掃引時間　１サンプル当たり１バースト以上が入る時間
掃引モード　単掃引	掃引モード　単掃引
検波モード　ポジティブピーク	検波モード　ポジティブピーク
その他の帯域では、搬送波周波数が400MHz帯の場合において、掃引周波数範囲を30MHzから３GHzまでとし、周波数掃引幅100MHz毎に連続して探索するものとする。	その他の帯域では、搬送波周波数が400MHz帯の場合において、掃引周波数範囲を30MHzから３GHzまでとし、周波数掃引幅100MHz毎に連続して探索するものとする。
［(3)・(4)　略］	［(3)・(4)　同左］
［３～６　略］	［３～６　同左］
［七　略］	［七　同左］